



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
VEECO
21 έως 25 Ιουνίου 2010

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Ειδικά πρόσφατα εμφάνισε δύο (2) νέες τεχνικές : ScanAsyst & PeakForce QNM. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε ένα σεμινάριο για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM) καθώς και την παρουσίαση των δύο νέων ανωτέρω τεχνικών που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 – Ηράκλειο Κρήτης

Τοποθεσία : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμ. Χημείας, Αίθουσα σεμιναρίων 307.

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010 – Αθήνα

Τοποθεσία : Αναλυτικές Συσκευές, Τζαβέλλα 9, Χαλάνδρι, Αίθουσα σεμιναρίων 3^{ος} όροφος

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 – Πάτρα

Τοποθεσία : ΕΙΧΗΜΥΘ, Αίθουσα σεμιναρίων

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 – Θεσσαλονίκη

Τοποθεσία : Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης, Τμ. Χημείας, Βιβλιοθήκη εργαστηρίου Φυσικοχημείας (ισόγειο παλαιού κτηρίου)

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Ian Armstrong με ταυτόχρονη επίδειξη του AFM Model MultiMode 8.

09.30-10.00 Προσέλευση

10:00-10:05 Welcome to the Seminar

10:05-11:30 Scanning Probe Microscopy, New Trends & Developments

11:30-12:00 Διάλειμμα – Καφές - Αναψυκτικά

12:00-17:00 Workshop MultiMode 8

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210-6748973 (εσωτ. 810) ή fax 210-6748978, ή e-mail rgeorgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος
Χημικός ,Δ/ντής Πωλήσεων Veeco